学位論文要旨

Analysis of Radiation-Induced Clustered DNA Damage by Atomic Force Microscopy (原子間力顕微鏡を用いた放射線誘発クラスターDNA 損傷の解析)

氏 名 Xu Xu

放射線は、生物に対し致死および突然変異誘発効果を示す。その原因は、遺伝情報を担う DNA の損傷であり、損傷としては塩基損傷、脱塩基部位、DNA 一本鎖切断(SSB)、DNA 二本鎖切断(DSB)などが同定されている。放射線は飛跡に沿って分子を電離・励起することから、飛跡に沿った DNA 部位には局所的な多重損傷が生じ、飛跡から離れた部位には孤立損傷が生じると考えられている。DNA 二重らせん数ターン(10~20 bp)の中に複数の損傷を含む部位は、クラスターDNA 損傷とよばれる。クラスターDNA 損傷は近接した損傷の影響のため修復されにくく、その生成量およびクラスターDNA 損傷内に含まれる損傷数(損傷多重度)は、放射線の生物影響に密接に関係していると考えられている。

近接した SSB と SSB を相補鎖に含む損傷は最も単純なクラスターDNA 損傷(DSB)であり、電気泳動により検出可能である。さらに、これまでの研究で、近接した塩基損傷と塩基損傷あるいは塩基損傷と SSB を相補鎖に含む損傷部位も DNA グリコシラーゼ処理により DSB に変換することにより検出可能になった。以上のように、損傷多重度が 2 のクラスター DNA 損傷は、実験的に検出可能となった。しかし、この方法では、さらに高い損傷多重度のクラスターDNA 損傷は区別できないため、新しいクラスターDNA 損傷の分析法が待たれていた。本研究では、新規なクラスターDNA 損傷分析法確立を目的として、DNA 損傷部位をストレプトアビジン標識し原子間力顕微鏡(AFM)で可視化分析する方法を検討した。

本研究では、まず、2つの近接した損傷を AFM で分離して観察できるかどうか調べるために、モデル DNA を調製した。pGL4.50 プラスミドを鋳型とし、ウラシルを 2 つ含むプライマーを用いて 738 bp の DNA を増幅した。2 つのウラシルの間隔は 3 塩基および 8 塩基とした。PCR 産物をウラシル DNA グリコシラーゼで処理し、ウラシルを脱塩基部位に変換した。Aldehyde Reactive Probe (ARP)、ストレプトアビジンとインキュベートすることにより損傷(ウラシル)をアビジン標識し AFM で観察した。2 つの損傷が 3 塩基離れたモデルクラスター損傷を含む DNA を AFM で観察した結果、約 60%の部位で 2 つの損傷が分離されて観察された。8 塩基間隔で損傷を含むモデル DNA でも同様の値が得られた。また、AFM で観察されたストレプトアビジンの見かけの直径は約 $10\sim15~\mathrm{nm}~(=29\sim44~\mathrm{bp})$ であった。本研究では、この距離内に存在する損傷(部分的に分離される損傷)を便宜的にクラスター損傷とし、この距離より離れた損傷を孤立損傷とした。

次に、放射線照射したプラスミドを用いてクラスターDNA 損傷を可視化分析した。pUC19プラスミド(2686 bp)を、線エネルギー付与(LET)が異なる Fe-イオン線(LET = 200 $keV/\mu m$)および X 線(LET = 1 $keV/\mu m$)で 200 Gy 照射した。照射したプラスミドを、酸化プリン塩基を除去する OGG1 および酸化ピリミジン塩基を除去する EndoIII で処理し、塩基損傷を脱塩基部位に変換した。次に、脱塩基部位を ARP、ストレプトアビジンで標識し AFM で観察した。なお、末端にアルデヒド型糖損傷を含む SSB も同様に標識されるため、AFM で観察される。

未処理プラスミドでは、プラスミド精製の際に生じたと考えられる損傷が僅かに含まれていた。Fe-イオン線照射後は、孤立損傷およびクラスターDNA 損傷を含むプラスミドの割合が増加した。未損傷プラスミドの割合(46.3 %)から、プラスミドあたりの平均ヒット数は 0.77 と見積もられた。したがって、観察された孤立損傷およびクラスターDNA 損傷は Fe-イオン線の多重ヒットではなく、主にシングルヒットで生じたと考えた。クラスターDNA 損傷のタイプとしては、損傷多重度が 2 の損傷に加え、損傷多重度が 3 および 4 の損傷が観察された。さらに、1 分子内に複数(2 または 3)のクラスター損傷部位を含むプラスミドが観察された。 2 級照射では、未損傷プラスミドの割合(2 またいのでもに、2 が、2 が、2

以上、本研究により、放射線は損傷多重度が2のクラスターDNA損傷だけではなく、より高い損傷多重度(3 および 4)のクラスター損傷を生成すること、また、飛跡上に複数のクラスター損傷部位を生成することが明らかとなった。さらに、LETが高いFe-イオン線は、損傷多重度が高いクラスターDNA損傷を生成するだけでなく、飛跡上におけるクラスター損傷の生成頻度も高いことが示された。これらの特徴は、高LET放射線が示す高い生物影響と関わっている可能性がある。本研究の成果は、放射線の生物作用におけるクラスターDNA損傷の役割解明、ならびにクラスターDNA損傷を指標とするがんの放射線治療確立などに貢献すると考えられる。